N on PTO 892.

PAT-NO:

JP362065477A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62065477 A

TITLE:

ORGANIC THIN FILM RECTIFYING DEVICE

PUBN-DATE:

March 24, 1987

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

MOTOMA, NOBUHIRO MIZUSHIMA, KOICHI AZUMA, MINORU MIURA, AKIRA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP60205726

APPL-DATE: September 18, 1985

INT-CL (IPC): H01L029/91, H01L049/02

US-CL-CURRENT: 257/E51.048

ABSTRACT:

PURPOSE: To facilitate extremely high speed switching operation by a method wherein an organic thin film in a junction structure of metal/organic thin film/ metal is composed of a laminated structure of thin films containing donor type organic molecules and thin films containing acceptor type organic molecules to provide rectifying characteristics.

CONSTITUTION: 10 layers of LB films 2 made of tetrathiafulevalene (TTF) as a

donor type molecule are formed on an Al substrate 1 and 10 layers of LB films 3

made of tetracyanoquinodimethane (TCNQ) as an acceptor type molecule are formed

on the films 2. An Al electrode 4 is formed on the films 3 by evaporation.

When a bias is zero, the ionizing potential IPD of the LB film 2 containing

donor type molecules is small and the electron affinity EA of the LB film 3

containing acceptor type molecules is large and difference between those two

values is, for instance, less than about 1eV. When a forward bias is applied,

electron transition from the electron conditions of the LB film 2 to the

electron conditions of the LB film 3 is induced and a forward current is

applied. When a reverse bias is applied, potential barrier between the

electron conditions of the LB film 3 and the electron conditions of the LB film

2 is high so that no electron transition is induced and hence no current is applied.

COPYRIGHT: (C) 1987, JPO&Japio

昭62-65477 ⑫公開特許公報(A)

(5) Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

昭和62年(1987)3月24日 四公開

29/91 H 01 L 49/02 7638-5F 6466-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

有機薄膜整流案子 49発明の名称

> 昭60-205726 创特 顋

昭60(1985)9月18日 29出

間 明 源 砂発 者 島 者 水 明 ⑫発

弘 信 公

川崎市幸区小向東芝町1番地

川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 株式会社東芝総合研究所内

明 者 東 個発

実

川崎市幸区小向東芝町1番地

株式会社東芝総合研究所内

明 三 浦 明 者 砂発

川崎市幸区小向東芝町1番地 川崎市幸区堀川町72番地

株式会社東芝総合研究所内

芝 式会社東 顋 人 创出

外2名 弁理士 鈴江 武彦 理 少代 人

明

1. 発明の名称

有機部膜整流素子

2. 特許請求の範囲

- (1) 金属/有機溶膜/金属の接合構造を有し、 有機薄膜をドナー性有機分子を含む薄膜とアクセ プタ性有機分子を含む薄膜の積蓄構造としたこと を特徴とする有機薄膜整旋素子。
- (2) ドナー性有機分子を含む薄膜とアクセブ タ性有限分子を含む薄膜の間に絶縁性有限分子か らなる薄膜を介在させた特許請求の範囲第1項記 並の有機薄膜整流素子。
- (3) 有機弾験はラングミュア・プロジェット 法により形成される特許請求の範囲第1項記載の 有概薄膜整流素子。
- 3、発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は有限薄膜を用いた金属/有限薄膜/金 異構造の整弦素子に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

近年、ラングミュア・プロジェット法(以下、 LB法)に代表される有機分子の超薄膜形成技術 の進展により、有機嫌護を用いた来子の検討が哲 発化している。ダーラム(Duhram)大学のロバ ーツ (G. G. Roberts) の、有機薄膜を絶縁鏡 として用いたMIS乗子の研究を代表として、こ の種の研究が各研究機関で行われている。有機材 料中では一般に、無限半導体と比較して電子移動 度が小さいため、これまで超高速素子への応用例 は発表されていない。

無限半導体材料を用いた素子においても、サブ p sec の動作速度を有する非線形素子の提案は、 分子線エピタキシー法(MBE法)で形成した GaAs-A&GaAsヘテロ接合を用いた四格 子素子等に僅かに見られるに過ぎない。しかしこ の様な無機半導体を用いた超格子素子は、極めて 高価な製農装置と厳密な制御を必要とする。また 高速化のためには、各層の厚みを数10人といっ た薄いものにすることが必要である。この様な舞 い無機半導体顕襲を用いた素子では、ヘテロ接合 界面の結晶性劣化のために再現性が悪く、また態的に極めて不安定なものとなり、耐久性に乏しい。 (発明の目的)

本発明は上記した点に盛みなされたもので、有機分子の障膜を用いて超高速のスイッチング動作を可能とした有機薄膜整弦業子を提供することを目的とする。

(発明の観要)

本発明は、金属/有機得膜/金属の接合構造を用い、その有機解膜を、ドナー性有機分子即ちイオン化ポテンシャル(IP)が小さく他の分子に電子を供給して自らはプラスのイオン状態になり思い分子を含む薄膜と、アクセフタ性有機分子を受いて、変化を変更したものである。

有機分子の特徴として、分子設計と化学合成により、そのイオン化ポテンシャル(『P)と電子 親和力(E)の値を任意に制御できること、更に

連い整流素子が得られる。しかも、無機半導体の 超格子構造を形成する場合に比べると、製膜が容 思であり、接合界面の結晶性劣化という問題もな いため、熱的安定性に優れ、価格の点でも有利に なる。従って本発明の整流素子は、各種論理素子 や配復素子等への応用が期待される。

(発明の実施例)

以下本発明の実施例を説明する。

A & 基板上に、ドナー性分子としてテトラチアフルバレン(TTF)を用いたしB膜を10撮形成し、更にその上にアクセプタ分子としてテトラシアノキノジメタン(TCNQ)を用いたLB膜を10畳形成した。そしてこの上にA & 電極を競替法により形成した。

第1回はこのようにして形成された整度素子を示す。1がA & 基板、2 がドナー性分子を含む L B 膜、3 はアクセプタ性分子を含むしB膜、4 はA & 電極である。

第2回はこの整復業子の動作を説明するための パンド図である。(a)は繋パイアス時であり、 これらの値が広範囲にわたっていること、が挙げられる。これは、無機材料にはない有機材料に持有のものである。しかも、し日法に代表される有機解説の形成技術の進歩により、多種多様の分子の単分子機や超薄膜が均一かつ欠陥のない状態で形成できる。

世のでは好きしくは、有機神説は日的 を発明される単分子説あるいは単分子説の を開始を用いる。有機や中を強い を開きたのは一般に無機半導体中の を発明される。 を開始に無機半導体中の を発明したがある。 を発いるの様な を発いるの。 を表がらためる。 を表がある。 を表がある。 を表がある。 を表がある。 を表がある。 を表がある。 を表がある。

また有機分子は閉殻構造をしているため、金属との界面に形成される界面準位の数は比較的少ない。

(発明の効果)

本発明によれば、十分に得い 2 種の有機薄膜を 金属の間に挟むという簡単な構成で、店谷遠度の

第3回はこの実施例の整旋素子について測定した電流一電圧特性である。図示のように整旋特性、即ちダイオード特性を示す。

またこの実施例の整選素子の周波数応答特性を 概定したところ、500G比まで応答することが 確認され、高速スイッチング動作が可能であるこ とが明らかになった。

本実施例の整流素子での整備特性のメカニズム

と高速応答特性の理由を少し詳しく説明すると、 以下の通りである。バイアス素の状態でドナー性 分子を含むLB膜2の電子状態を占有していた電 子は、バイアス電圧が、

((1pp-EA)-e~/a)/e [V]
を超えると、アクセフタ性分子を含むし、B 製 3 の電子状態へと選絡する。 1pp が小変に外のがたる。 2 程度の本実に例のがこれが原に生じる。 2 セフタセカる。 4 年 で かって が で は で で か で と と で で が で と で で と で で か で と と で で が で と と で で と で で と と で で と と で で と と で で と と で で で と と で で で は ない。 は 生 じ ない。

一方、上述の電子選移は、遷移に関連する各々の電子状態間の遷移行列要素HIIの大きさによって支配され、遷移に要する時間はその遷移行列要素HIIの逆数に比例する。遷移行列要素HIIは、ドナー性分子、アクセプタ性分子の種類、その間

またアクセプタ性分子としても上記実施例の TCNQの他に以下のようなものを用い得る。

 の距離および位置関係によって決まるが、両分子を選当に選ぶことにより、1meV~1eVの範囲のものを設定することが可能である。従ってスイッチング時間が1p Sec ~10~~p sec と極めて高速のスイッチング動作が可能となるのであ

本発明は上記した実施例に限られるものではない。例えばドナー性分子は上記実施例のTTFの他に、以下のようなものを用い得る。

ジメチルテトラチアフルバレン(DMTTF)、
テトラメチルチアフルバレン(TMTTF)、
ヘキサメチレンテトラチアフルバレン(HMTT
F)、ジセレナジチアフルバレン(DSDTF)、
ジメチルジセレナジチアフルバレン(DMDSD
TF)、ヘキサメチレンジセレナジチアフルバレン
ン(HMDSDTF)、テトラセレナフルバレン
(TSF)、テトラメチルテトラセレナフルバレン
フルバレン(HMTSF)、テトラセレノテトラ
セン(TST)、キノリン(Q)、ローメチルキ

7.7.8.8-テトラシアノキノジメタン(C TCNQ), 2-70-6-7, 7, 8, 8-5-6 ラシアノキノヴメタン(BTCNQ)、2.5-メタン(DBTCNQ)、2,5-ジョードー7. CNQ), 2-000-5-850-7.7.8, 8-テトラシアノキノジメタン(CMTCNQ)、 2 - プロモー5-メチルー7.7.8.8-テト ラシアノキノジメタン(BMTCNQ)、2-ョ - ド - 5 - メチル - 7.7.8.8 - テトラシア ノキノジメタン(IMTCNQ)、11, 11, 12, 12-テトラシアノー2.6-ナフトキノジメタン (TNAP), 1, 1, 2, 3, 4, 4-4+ シアノフタジエン(H C B)、ナトリウム 13, 13, 14, 14-テトラシアノジフェノキノジメタン (NaTCDQ)、テトラシアノエチレン(TC N E)、O - ペンソキノン、D - ペンソキノン、 2.6-ナフトキノン、ジフェノキノン、テトラ シアノジキノン(TCNDQ)、p-フルオラニ

ル、テトラクロロジフェノキノン。

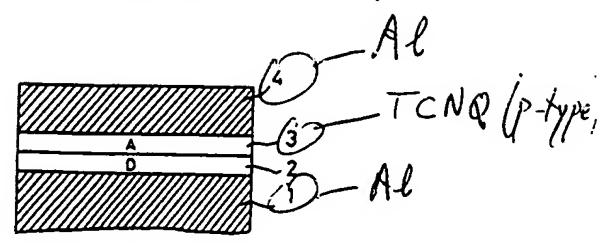
また上記実施例ではドナー性分子圏とアクセプタ性分子圏のみの積層構造により整流特性を得るようにしたが、これらの間に絶縁性の有機分子を用いた超輝膜を介在させてもよい。

4. 図面の簡単な説明

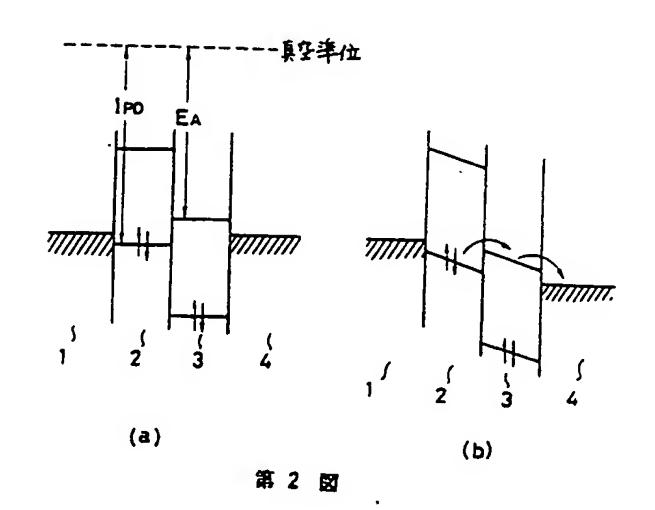
第1回は本発明の一実施例の有機弾膜整施業子を示す図、第2回(8)(b)はその整流特性を 説明するためのパンド図、第3回は同じく得られ た整流特性を示す図である。

1 … A & 基板、2 … ドナー性分子を含むしB膜、3 … アクセプタ性分子を含むLB膜、4 … A & 電極。

出版人代理人 弁理士 鈴红武彦



第1図



電流

第 3 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.